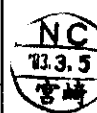


△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	電圧	150V AC (DC)			電流	1 A			
	使用温度範囲	-35℃ ~ +85℃ (注1)			保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (注3)			
	使用湿度範囲	20% ~ 80% (注2)			保存湿度範囲	40% ~ 70% (注3)			
性能									
	項目	試験方法			規格		QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○	
	表示	目視にて確認する。					○	○	
電気的性能	接触抵抗	100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。			30 mΩ以下		○	—	
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。			30 mΩ以下		○	—	
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。			500 MΩ以上		○	—	
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—	
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz、片振幅 0.75 mm、 加速度 - m/s ² で3方向各2時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: - mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波3方向各3回試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: - mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2 °C、湿度 90 ~ 95 %中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 500 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → +5~35 → +85 → +5~35 °C 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15 分 を5サイクル試験する。			① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 500 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—	
	半田耐熱性	【リフローの場合】 《リフロー部》MAX 250℃ 10秒以内 220℃以上 70秒以内 《予熱部》150~160℃ 60~120秒 リフロー炉に2回通し、常温常湿中に 1時間放置後、測定する。 【手半田の場合】 半田ごてで350±5℃、5±1秒の条件にて 半田付けを行う。但し端子に力を加えないこと。			外観の変形及び端子などの 著しいガタがないこと。		○	—	
	半田付け性	半田温度 235±5 °C、 浸せき時間 3 秒間の半田付けを行う。			半田浸せき面の95%以上が 新しい半田でぬれていること。		○	—	
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温度湿度範囲を適用。 試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。					製図	担当	検図	承認	出図
									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表			製品名 DF14H-20P-1.25H(56)				
旧CL CL		図番 SLC4-161459-03			製品コード CL538-0167-0-56			1 1	